				ì		Š		Š		٠				į			Ì		Š	į		۰	ì		i	ş						ì				Š							Ŷ	3	ě		į	١		Ŷ	Š		۱	ì	i				١			Ŷ	i		Š				Š	Š					į	į	i	
į	ľ	١	ļ	J	1	į	į	Ė	ı			ľ	ŀ	ŀ	Ė		١	Š	Š	Ì	l	ì	Ĺ	į	(3	ŀ	i	í	۱	i	ŀ	ř	١	ć	İ	ţ	1	ĺ	9	Ė	ì	Š	š	è	ì	١		ì	ì		3	È		١	į	?	Š	š	٤	١	ì	:	3		ì	١	ŝ		3	ì		ì	ì	:	è	j	
	į	i	Š	Š	į			į	١	Š	į	Š	Š		į	i	j	į	Š	ì	١	į			i		Š	Š		i			Š	Š		į	ì	١	Š	Š	Š		Š	š	ě	i	8	8	8	Š	ä	Š	8	Š	i		ì		į	Š	ì	Š	i		Š	Š	Š		Š	è	i	Š		Š	Š		j	

Notice of References Cited	Application/Control No. 10/787,297	Applicant(s)/Patent Under Reexamination XUE ET AL.					
Notice of Neterences Offen	Examiner	Art Unit					
	TUAN H. NGUYEN	2618	Page 1 of 1				

U.S. PATENT DOCUMENTS

*		Document Number Country Code-Number-Kind Code	Date MM-YYYY	Name	Classification
*	Α	US-2004/0005904	01-2004	Wolf et al.	455/519
	В	US-			
	C	US-			
	D	US-			
	Е	US-			
	F	US-			
	G	US-			
	Ι	US-			
	-	US-			
	J	US-			
	К	US-			
	┙	US-			
	М	US-			

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

*		Document Number Country Code-Number-Kind Code	Date MM-YYYY	Country	Name	Classification
	N					
	0					
	Р					
	Q					
	R					
	S					
	Т					

NON-PATENT DOCUMENTS

*		Include as applicable: Author, Title Date, Publisher, Edition or Volume, Pertinent Pages)
	C	
	V	
	w	
	x	

*A copy of this reference is not being furnished with this Office action. (See MPEP § 707.05(a).) Dates in MM-YYYY format are publication dates. Classifications may be US or foreign.